# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-262482

(43)Date of publication of application: 07.10.1997

(51)Int,CI.

B01J 35/02 B01D 53/86 B01D 53/94 B01J 21/10 B01J 23/22 B01J 23/26 B01J 23/34 B01J 23/38 B01J 23/70 B01J 23/70 B01J 23/745 B01J 23/755 CO7C CO7C 5/25 CO7C 11/08

(21)Application number: 08-311176

(22)Date of filing:

08.11.1996

(71)Applicant:

// CO7B 61/00

SEKIYU SANGYO KASSEIKA CENTER

(72)Inventor: ANPO SHOICHI

YAMASHITA HIROMI KANAI SAKUNOBU SATO KAZUHITO FUJIMOTO HISANORI

(30)Priority

Priority number: 08 26213

Priority date: 22.01.1996

Priority country: JP

# (54) PHOTOCATALYST, ITS PRODUCTION AND PHOTOCATALYTIC REACTION METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a photocatalyst capable of exhibiting its catalytic activityeven by irradiation with visible light and to provide a photocatalytic reaction method using the photocatalyst under irradiation with visible light. SOLUTION: Ions of one or more kinds of metals selected from among Cr, V, Cu, Fe, Mg, Ag, Pd, Ni, Mn and Pt are incorporated into

SOLUTION: Ions of one or more kinds of metals selected from among Cr, V, Cu, Fe, Mg, Ag, Pd, Ni, Mn and Pt are incorporated into TiO2 from the surface toward the interior by ≥1 × 1015 ions/g-TiO2. Ions of one or more kinds of metals selected from among Cr, V, Cu, Fe, Mg, Ag, Pd and Pt are accelerated to high energy of ≥30keV, radiated on TiO2 and introduced into the TiO2. Photocatalytic traction is allowed to take place in the presence of the resultant photocatalyst by irradiation with light in the region from UV to visible light.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

30.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-262482

(43)公開日 平成9年(1997)10月7日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号 庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 0 1 J 35/02		B 0 1 J 35/02	J
B01D 53/86		21/10	Z
53/94			Α
B 0 1 J 21/10		23/22	Z
			Α .
	審査請求	未請求 請求項の数5 FD	(全 11 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-311176	(71)出願人 590000455	
		財団法人石油	産業活性化センター
(22)出顧日	平成8年(1996)11月8日	東京都港区虎	ノ門四丁目3番9号
•		(72)発明者 安保 正一	•
(31)優先権主張番号	特願平8-26213	大阪府堺市学	買町1-1 大阪府立大学
(32)優先日	平 8 (1996) 1 月22日	工学部内	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 山下 弘巳	
	•	大阪府堺市学	圍町1-1 大阪府立大学
		工学部内	
	•	(72)発明者 金井 作信	•
		茨城県岩井市:	矢作3004-67
		(74)代理人 弁理士 折口	信五
			最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光触媒、光触媒の製造方法および光触媒反応方法

# (57)【要約】

【課題】 可視光の照射によっても触媒活性を発現する ととができる光触媒、及びその光触媒の製造方法、並び にその光触媒による可視光照射下での光触媒反応方法を 提供する。

【解決手段】 Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd Ni、Mn およびPt からなる群から選択される 1 種以上の金属のイオンが  $1 \times 10^{15}$  イオン/g-TiO 以上の割合で酸化チタンの表面から内部に含有させる。Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd およびPt からなる群から選択される 1 種以上の金属のイオンを 30 Ke V 以上の高エネルギーに加速して、酸化チタンに照射し、該金属イオンを酸化チタンに導入する。上記の光触媒の存在下、紫外光から可視光の光を照射して光反応を行う。

•

#### [特許請求の範囲]

【請求項1】  $Cr. V. Cu. Fe. Mg. Ag. Pd. Ni. Mn およびPt からなる群から選択される1種以上の金属のイオンが<math>1 \times 10^{13}$  イオン/g 一酸化チタン以上の割合で酸化チタンの表面から内部に含有されていることを特徴とする光触媒。

【請求項2】 Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd、Ni、MnおよびPtからなる群から選択される1種以上の金属のイオンを30KeV以上の高エネルギーに加速して、酸化チタンに照射し、該金属イオンを酸化 10チタンに導入することを特徴とする光触媒の製造方法。 【請求項3】 請求項1に記載の光触媒の存在下、紫外

【請求項3】 請求項1 に記載の光触媒の存在下、紫外 光から可視光の光を照射して光反応を行うことを特徴と する光触媒反応方法。

【請求項4】 請求項1 に記載の光触媒の存在下、紫外 光から可視光の光を窒素酸化物に照射して分解反応を行 うことを特徴とする窒素酸化物の分解反応方法。

【請求項5】 請求項1 に記載の光触媒の存在下、紫外 光から可視光の光をブテンに照射して異性化反応を行う ことを特徴とするブテンの異性化反応方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、可視光の照射によっても触媒活性を発現することができる光触媒、及びその光触媒の製造方法、並びにその光触媒による、可視光照射下での窒素酸化物の分解反応、ブテンの異性化反応などの光触媒反応方法に関するものであり、詳しくは加速された高エネルギーの金属イオンを照射することにより金属イオンを導入するイオン注入法を適用して特定の金属イオンを酸化チタンに導入した光触媒に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】酸化チタンによる光触媒反応は、常温でクリーンに光エネルギーを化学エネルギーに変換する環境調和型プロセスとして注目され、環境浄化などへの応用研究が活発に行われている。特に、酸化チタンの光触媒活性を向上させるための超微粒子化やPt、Ag、Niなどの金属添加、可視光領域(約400nm~800nm)の光を利用するため、色素を酸化チタンに吸着させる研究などが行われている。

【0003】しかしながら、これまでの光触媒では約380nmよりも短い液長の紫外光領域では作用するが、液長の長い可視光領域での定常的な光触媒反応は不可能とされてきた。例えば、従来の酸化チタンを用いる光触媒反応の例として、窒素酸化物の分解反応、ブテンの異性化反応などが挙げられるが、これらの光触媒反応は紫外光照射下でのみ効率的に進行する。このため、太陽光だけでは5%程度の紫外光しか利用できず、実際に反応を起こさせるためには、水銀ランプのような紫外光照射が可能な光源が別途必要であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況の下になされたものであって、その目的は酸化チタンの光吸収帯を可視光領域までシフトさせ、可視光領域 においても安定的に作用する光触媒を提供すること、およびこの光触媒に紫外光から可視光の光を窒素酸化物、 ブテンなどの存在下で照射することによる窒素酸化物の 分解反応およびブテンの異性化反応などの光触媒反応方 法を提供することである。

0 [0005]

30

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、半導体分野におけるドービングの手段に利用されているイオン注入法に着目し、種々の触媒材料に対するイオン注入による触媒の電子状態の改質について検討し、さらに、酸化チタンへの種々の金属イオンの影響を調べたところ、驚くべきことに特定の金属イオンを酸化チタンに導入させて得られる光触媒が、紫外光領域はもちろんのこと、これまで可能とされてきた可視光領域(約400mm~800mm)の光の吸収を起こし、可視光の光照射下での窒素酸化物の分解、およびブテンの異性化反応などの種々の光触媒反応に常温で活性を示すことを見い出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

[0006] すなわち、本発明は、Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd、Ni、MnおよびPtからなる群から選択される1種以上の金属のイオンが1×10<sup>15</sup>イオン/gー酸化チタン以上の割合で酸化チタンの表面から内部に含有されていることを特徴とする光触媒を提供するものである。また、本発明は、Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd、Ni、MnおよびPtからなる群から選択される1種以上の金属のイオンを30KeV以上の高エネルギーに加速して、酸化チタンに照射し、該金属イオンを酸化チタンに導入することを特徴とする光触媒の製造方法を提供するものである。さらに、本発明は、上記の光触媒の存在下、可視光を照射して光反応を行うことを特徴とする光触媒反応方法を提供するものである。以下、本発明を詳細に説明する。

【0007]本発明の光触媒は酸化チタンに特定の金属 イオンが含有されているものである。酸化チタンに導入される金属イオンは、Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd、Ni、MnおよびPtからなる群から選択される1種以上の金属のイオンであり、好ましくはCr、V、Fe、Ni、Mnであり、特に好ましくはCr、Vである。また、前記金属イオンの電荷は特に制限ないが、通常注入前の金属イオンが加速された状態では1価で存在する場合が多い。なお、注入後は、酸化チタン中で金属イオンは、1~5価として存在する。これらの金属イオンは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を組50合せて用いてもよい。

[0008]酸化チタンに導入される金属イオンの導入量は、 $1\times10^{11}$ イオン/g-酸化チタン以上である。金属イオンの導入量の単位は、酸化チタン1 g=治たりの金属イオンの数を示す。金属イオンの導入量が $1\times10^{11}$ イオン/g-酸化チタン未満であると可視光領域の光を吸収し光触媒活性を発現する効果が得られない。金属イオンの導入量の上限は特に制限ないが、金属イオンの導入量が $1\times10^{11}$ イオン/g-酸化チタンを超えると前記光触媒活性が発現する効果が得られないことがあるので好ましくない。金属イオンの導入量の好ましい範囲は、金属イオンの種類により異なるが、通常 $1\times10^{16}$ ~ $5\times10^{16}$ 4オン/g-酸化チタンの範囲が好ましく、特に $1\times10^{16}$ ~ $5\times10^{17}$ 7イオン/g-酸化チタンの範囲が好ましい。

【0009】基材である酸化チタンに導入された金属イ オンは、酸化チタンの表面に存在してもよいが、酸化チ タンの内部に大部分が存在することが好ましく、金属イ オンの90%以上が酸化チタンの内部に存在することが より好ましく、さらに金属イオンの95%以上が酸化チ タンの内部に存在することが好ましく、特に金属イオン の99%以上が酸化チタンの内部に存在することが好ま じい。また、酸化チタンの内部に導入された金属イオン は、表面と表面から1000人の深さの間に存在すると とが好ましく、特に表面と表面から300人の深さの間 に存在することが好ましい。さらに、酸化チタンの内部 に導入された金属イオンは、均一に分散されていること が好ましい。なお、基材である酸化チタンとしては、T iOz、SrTiOzなどが挙げられる。また、酸化チタ ンの結晶形は、特に制限されず、アナターゼ型、ルチル 型、その他種々のタイプのものを用いることができる。 本発明の光触媒は、前記金属イオンを酸化チタンの表面 から内部に特定量含有している酸化チタンを成分とする ものであるが、他の光触媒を併用してもよいし、他の基 材を含有していてもよい。本発明の光触媒の形状は、種 々の形態であってよく、例えば粉末、粒子、ペレット、 膜などが挙げられ、粉末が好ましい。光触媒の粉末の平 均粒径は、特に制限ないが、通常1~1000nmの範 囲のものであればよく、好ましくは1~500nmの範 囲であり、特に好ましくは5~50nmの範囲である。 本発明の光触媒は、そのまま用いてもよいが、光触媒と 40 バインダーとの混合物を塗布して膜状にして用いてもよ いし、また紙などの支持体に担持させてもよい。

【0010】本発明の光触媒の製造方法においては、Cr、V、Cu、Fe、Mg、Ag、Pd、Ni、MnおよびPtからなる群から選択される1種以上の金属のイオンを30KeV以上の高エネルギーに加速して、酸化チタンに照射する。金属イオンのエネルギーは、30KeV以上であるが、好ましくは50~400KeVの範囲であり、特に好ましくは100~200KeVの範囲である。好ましい範囲は、金属イオン注入をより均一に50

分散させてとができ、かつ触媒の金属イオンによる構造 破壊を防ぎ易い。金属イオンの照射量の好ましい範囲 は、金属イオンの種類により異なるが、通常  $1 \times 10^{14}$   $\sim 1 \times 10^{19}$  イオン/ c  $m^2$  の範囲が好ましく、特に  $1 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{17}$  イオン/ c  $m^2$  の範囲が好ましい。金属イオンの照射量の単位は、照射面積 1 c  $m^2$  当 たりの金属イオンの数を示す。

【0011】本発明の光触媒を得るために用いられる金属イオンの導入法は、半導体分野における不純物のドービングの手段に利用されているイオン注入法であり、加速された高エネルギーの金属イオンを半導体試料に照射させることにより金属イオンを半導体に注入し、半導体の電子状態の改質を行うものである。また、イオン注入法は、鋼を中心とする金属材料の表面改質にも利用されている。

[0012]本発明の光触媒の製造方法において使用する酸化チタンの形状は、特に制限ないが、粉末状が好ましい。酸化チタンの粉末の平均粒径は、特に制限ないが、通常 $1\sim1000$ nmの範囲のものであればよく、好ましくは $1\sim500$ nmの範囲であり、特に好ましくは $5\sim50$ nmの範囲である。

【0013】本発明の光触媒は、紫外光領域はもちろん のとと、これまで不可能とされてきた可視光領域(約4 00~800nm)の光の吸収が起こる。このため、本 発明の光触媒を用いて紫外光から可視光の光を照射して 光反応を行うととができる。本発明の光触媒反応方法に おいて使用される光は、紫外光から可視光の光であり、 紫外光だけでもよいし、可視光だけでもよい。また紫外 光から可視光の特定の波長の光を選定して照射してもよ い。なお、紫外光から可視光の光が照射されていれば、 との範囲外の光、例えば遠紫外光、赤外光が含まれてい ても差し支えない。本発明の光触媒反応方法において使 用される紫外光から可視光の光の波長の好ましい範囲 は、250~500 n mの範囲である。本発明の光触媒 反応方法において使用される紫外光から可視光の光の照 射強度は、特に制限なく光触媒反応の種類に応じて適宜 選定すればよい。

[0014]本発明の光触媒反応方法において使用される光触媒の量は、特に制限なく反応系に応じて適宜選定すればよいが、通常原料1モル当たり0.01~10,000gである。本発明の光触媒反応の例としては、例えば、紫外光から可視光の光を窒素酸化物の存在下において光触媒に照射して分解反応を行う窒素酸化物の分解反応方法、紫外光から可視光の光をブテンの存在下において光触媒に照射して異性化反応を行うことを特徴とするブテンの異性化反応方法などが挙げられる。ブテンの異性化反応としては、シスー2ーブテンと1ーブテン間の異性化、シスー2ーブテンとトランスー2ーブテン間の異性化が挙げられる。

) 【0015】また、本発明の光触媒反応のその他の例と

6

しては、例えば上記ブテンの異性化反応以外のアルケン の光異性化反応、プロピレンと水からのエタンやメタン 生成のようなアルケン・アルキンの水による光水素化分 解反応、2-プロパノールからのアルデヒド・ケトン生 成のようなアルコールの光酸化反応、一級アミンからの 二級アミン生成反応、メタン・水・アンモニアからのグ リシン・アラニンなどの光アミノ酸合成反応、CO+H , O ← → H<sub>2</sub> + C O<sub>2</sub> のような光水性ガスシフト・光逆水 性ガスシフト反応などの種々の光触媒反応が挙げられ る。また、無尽蔵でクリーンな太陽光エネルギーの変換 10 と蓄積という観点から、重要なものとしては太陽光を利 用し、二酸化炭素の水による還元固定によって有用な有 機化合物に導く光触媒反応が挙げられる。具体的には、 二酸化炭素と水からのメタン合成反応、メタノール合成 反応、ホルムアルデヒド合成反応などである。同様に、 可視光領域の光を利用した水の水素と酸素への光分解 は、枯渇しないエネルギー源と無尽蔵で安価な原料を用 い、貯蔵可能で環境汚染を伴わないという点から、太陽 光エネルギーの理想的な有効利用法である。

【0016】本発明の光触媒は、その光触媒特性を利用 して様々な用途に適用可能である。例えば、人体に直接 悪影響を与え、かつ光化学スモッグや酸性雨の発生原因 ともなり得るため、その効果的な除去手段の開発が望ま れている、各種の燃焼機関より排出されている窒素酸化 物についても、本発明の光触媒を用いることにより、こ れらの分解除去が可能となる。すなわち、建物の外壁も しくは塗装、道路や自動車の塗装、窓ガラスなどに適用 することにより、太陽光照射下もしくは電灯などの何ら かの光源下で、窒素酸化物が窒素と酸素に分解除去され 無害化される。また、水中の有害物質を本発明の光触媒 30 で分解し、水を浄化することが可能となる。水中の有害 物質としては、例えばトリハロメタンなどが挙げられ る。本発明の光触媒反応方法は、常温で行うことができ るが、それに限定されず、通常0~200℃の範囲で行 うことが可能である。

# [0017]

【作用】本発明の光触媒の光触媒反応機構については、現在のところ明らかではないが、従来より行われてきた触媒調製技術である含浸法、共沈法、アルコキシド法などによる酸化チタンを主成分とする触媒に金属を導入す 40 る方法では、可視光領域の光を吸収して光触媒活性を示すという本発明の効果は全く発現しないことから、本発明の光触媒の内部に金属イオンが均質かつ高分散に導入されていることに起因するものと考えられる。つまり、金属イオンが均質かつ高分散に導入されることにより、酸化チタンの電子状態に摂動が生じ、可視光を吸収できるようになり、この光の吸収により酸化チタン中に電子と正孔が生じ、光照射で生成した電子と正孔のうち、電子が表面の金属サイトへ移り、そこで金属の触媒作用により還元反応が効率よく進み、そのため正孔も酸化チタ 50

ン上で効率よく酸化反応が進み、その結果光触媒反応が 効率よく進行するものと思われる。

#### [0018]

【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例によりさらに具体的に説明する。なお、本発明は、これらの例によって何ら制限されるものではない。実施例において、酸化チタンへの金属イオンの導入量の測定、注入金属イオンの測定は、三次元SIMS(二次電子イオン質量分析法)、およびXPS(光電子分光法)より行った。

## 0019]実施例1

半導体の不純物のドーピングに用いる200keVイオン注入装置を用い、Vイオンを加速して150keVのエネルギーにして、平均粒子径21nmである酸化チタン(デグサ社製、商品名:P-25)に、Vイオン照射量を7.5×10<sup>11</sup>イオン/cm<sup>1</sup>にして照射し、酸化チタンにVイオンを注入した。得られたVイオンが導入された酸化チタンからなる光触媒のVイオンの分散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定した結果、Vイオン導入量は7.5×10<sup>16</sup>イオン/g-Ti〇₁であり、酸化チタンの表面と表面から200Aの深さの間の内部にVイオン導入量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のようにして調製したVイオンを導入した酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを注入Vイオン量の関数として測定した。得られた吸収スペクトルを図1に示す。

# 【0020】実施例2

Vイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施例 1 と同様にして V イオンを注入した酸化チタンからなる 光触媒を調製した。

#### 加速エネルギー:150KeV

Vイオン照射量: 1.5×10<sup>16</sup>イオン/cm<sup>2</sup> 得られたVイオンが導入された酸化チタンからなる光触 媒のVイオンの分散状態を三次元SIMSおよびXPS により測定した結果、Vイオン導入量は1.5×10<sup>17</sup>イオン/g-TiO₂であり、酸化チタンの表面と表面 から200点の深さの間の内部にVイオン導入量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のようにして調製したVイオンを導入した酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを測定した。得られた吸収スペクトルを図1に示した。

#### 【0021】実施例3

Vイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施例 1と同様にしてVイオンを注入した酸化チタンからなる 光触媒を調製した。

加速エネルギー:150KeV

Vイオン照射量: 3.  $0 \times 10^{16}$  イオン/  $cm^2$  得られたVイオンが導入された酸化チタンからなる光触 媒のVイオンの分散状態を三次元S I M S およびX P S により測定した結果、Vイオン導入量は3.  $0 \times 10^{17}$  イオン/ g - T i O, であり、酸化チタンの表面と表面

から200点の深さの間の内部にVイオン導入量の99 %以上がほぼ均一に分散されているととが確認された。 上記のようにして調製したVイオンを導入した酸化チタ ンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを測 定した。得られた吸収スペクトルを図1に示した。

酸化チタン (デグサ社製、商品名: P-25) の紫外光 ~可視光吸収スペクトルを実施例1と同様に測定した。 得られた吸収スペクトルを図1に示した。図1より、酸 化チタン単独ではバンドキャップ値が約380nmで約 10 400nm以下の紫外光領域の光の吸収のみが起とり、 可視光領域の光吸収は全く起とらなかったが、Vイオン をイオン注入法により注入した酸化チタン光触媒上で は、400nm以上の可視光の吸収が起こっている様子 が分かる。

## [0023] 実施例4

[0022]比較例1

半導体の不純物のドーピングに用いる200KeVイオ ン注入装置を用い、Cェイオンを加速して150KeV のエネルギーにして、平均粒子径21nmである酸化チ タン (デグサ社製、商品名:P-25) に、Crイオン 照射量を1×1016イオン/cm²にして照射し、酸化 チタンにCrイオンを注入した。得られたCrイオンが 導入された酸化チタンからなる光触媒のCr イオンの分 散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定した結 果、Crイオン導入量は1×10<sup>17</sup>イオン/g-TiO ,であり、酸化チタンの表面と表面から200Aの深さ の間の内部にCェイオン導入量の99%以上がほぼ均一 に分散されていることが確認された。上記のようにして 調製したCrイオンを導入した酸化チタンからなる光触 媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを導入Cェイオン量 30 の関数として測定した。得られた吸収スペクトルを図2 に示す。

# [0024] 実施例5

Crイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施 例4と同様にしてCrイオンを注入した酸化チタンから なる光触媒を調製した。

## 加速エネルギー: 150KeV

Crイオン照射量: 1.5×10<sup>16</sup>イオン/cm<sup>2</sup> 得られたCrイオンが導入された酸化チタンからなる光 触媒のCェイオンの分散状態を三次元SIMSおよびX 40 PSにより測定した結果、Crイオン導入量は1.5× 10<sup>17</sup>イオン/g-TiO<sub>2</sub>であり、酸化チタンの表面 と表面から200点の深さの間の内部にCrイオン導入 量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認 された。上記のようにして調製したCrイオンを導入し た酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペ ・クトルを測定した。得られた吸収スペクトルを図2に示 した。

# [0025] 実施例6

Cァイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施 50 Feイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施

例4と同様にしてCrイオンを注入した酸化チタンから なる光触媒を調製した。

加速エネルギー: 150KeV

Crイオン照射量: 12×1016イオン/cm² 得られたCェイオンが導入された酸化チタンからなる光 触媒のCrイオンの分散状態を三次元SIMSおよびX PSにより測定した結果、Crイオン導入量は12×1 O<sup>17</sup>イオン/g-TiO<sub>2</sub>であり、酸化チタンの表面と 表面から200点の深さの間の内部にCrイオン導入量 の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認さ れた。上記のようにして調製したCェイオンを導入した 酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペク トルを測定した。得られた吸収スペクトルを図2に示し た。図2より、比較例1と同様に酸化チタン単独ではバ ンドギャップ値が約380nmで約400nm以下の紫 外光領域の光の吸収のみが起こり、可視光領域の光吸収 は全く起こらなかったが、Cェイオンをイオン注入法に より注入した酸化チタン光触媒上では、400nm以上 の可視光の吸収が起とっている様子が分かる。以上のよ うに、本発明の特定の金属イオンを含有した酸化チタン は、可視光領域の光を吸収するという、従来では考えら れなかった光学特性を発現することが明らかとなった。 [0026] 実施例7

半導体への不純物のドーピングに用いる200KeVイ オン注入装置を用い、Feイオンを加速して150Ke Vのエネルギーにして、平均粒子径21nmである酸化 チタン(デグサ社製、商品名:P-25)に、Feイオ ン照射量を7.5×1011イオン/cm2にして照射 し、酸化チタンにFeイオンを注入した。得られたFe イオンが導入された酸化チタンからなる光触媒のFeイ オンの分散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測 定した結果、Feイオン導入量は7.5×10<sup>16</sup>イオン /g-TiOzであり、酸化チタンの表面と表面から2 00Åの深さの間の内部にFeイオン導入量の99%以 上がほぼ均一に分散されていることが確認された。

# [0027] 実施例8

Feイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施 例7と同様にしてFeイオンを注入した酸化チタンから なる光触媒を調製した。

加速エネルギー:150KeV

Feイオン照射量: 1.5×10<sup>16</sup>イオン/cm<sup>2</sup> 得られたFeイオンが導入された酸化チタンからなる光 触媒のFe イオンの分散状態を三次元SIMSおよびX PSにより測定した結果、Feイオン導入量は1.5× 1017イオン/g-TiOzであり、酸化チタンの表面 と表面から200点の深さの間の内部にFeイオン導入 量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認 された。

## [0028] 実施例9

10

例7 と同様にしてF e イオンを注入した酸化チタンからなる光触媒を調製した。

加速エネルギー:150KeV

Feイオン照射量: 3.0×10<sup>16</sup>イオン/cm<sup>2</sup> 得られたFeイオンが導入された酸化チタンからなる光 触媒のFeイオンの分散状態を三次元SIMSおよびX PSにより測定した結果、Feイオン導入量は3.0×10<sup>17</sup>イオン/g-TiO<sub>2</sub>であり、酸化チタンの表面 と表面から200点の深さの間の内部にFeイオン導入量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認 10 された。

#### [0029] 実施例10

半導体の不純物のドーピングに用いる200KeVイオ ン注入装置を用い、Feイオンを加速して150KeV のエネルギーにして、平均粒子径21 nmである酸化チ タン (デグサ社製、商品名:P-25) に、Feイオン 照射量を2.2×10<sup>11</sup>イオン/cm<sup>2</sup>にして照射し、 酸化チタンにFeイオンを注入した。得られたFeイオ ンが導入された酸化チタンからなる光触媒のFeイオン の分散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定し 20 た結果、Feイオン導入量は2. 2×1016イオン/g -TiO,であり、酸化チタンの表面と表面から200 Aの深さの間の内部にFeイオン導入量の99%以上が ほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のよ うにして調製したFeイオンを導入した酸化チタンから なる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを注入Fe イオン量の関数として測定した。得られた吸収スペクト ルを図3に示す。

## 【0030】実施例11

Feイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施 30 例 10 と同様にして Fe イオンを注入した酸化チタンか らなる光触媒を調製した。

加速エネルギー: 150KeV

Feイオン照射量: 6.6×10<sup>15</sup>イオン/cm<sup>2</sup> 得られたFeイオンが導入された酸化チタンからなる光触媒のFeイオンの分散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定した結果、Feイオン導入量は6.6×10<sup>15</sup>イオン/g-TiO<sub>1</sub>であり、酸化チタンの表面と表面から200点の深さの間の内部にFeイオン導入量の99%以上がほば均一に分散されていることが確認40された。上記のようにして調製したFeイオンを導入した酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを測定した。得られた吸収スペクトルを図3に示した。

# [0031] 実施例12

Feイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施例10と同様にしてFeイオンを注入した酸化チタンからなる光触媒を調製した。

加速エネルギー: 150KeV

Feイオン照射量: 1. 3×10<sup>16</sup>イオン/cm<sup>2</sup>

得られたFeイオンが導入された酸化チタンからなる光触媒のFeイオンの分散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定した結果、Feイオン導入量は $1.3\times10^{11}$ イオン/g-TiO,であり、酸化チタンの表面と表面から200Aの深さの間の内部にFeイオン導入量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のようにして調製したFeイオンを導入した酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを図るに、得られた吸収スペクトルを図るに、のるより、酸化チタン単独ではバンドキャップ値が約380nmで約400nm以下の紫外光領域の光の吸収のみが起こり、可視光領域の光吸収は全く起こらなかったが、Feイオンをイオン注入法により注入した酸化チタン光触媒上では、400nm以上の可視光の吸収が起こっている様子が分かる。

#### 【0032】実施例13

半導体の不純物のドーピングに用いる200KeVイオ ン注入装置を用い、Niイオンを加速して150KeV のエネルギーにして、平均粒子径21nmである酸化チ タン (デグサ社製、商品名:P-25)に、Niイオン 照射量を2. 2×1011イオン/cm1にして照射し、 酸化チタンにNiイオンを注入した。得られたNiイオ ンが導入された酸化チタンからなる光触媒のNiイオン の分散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定し た結果、Niイオン導入量は2.2×1016イオン/g -TiO,であり、酸化チタンの表面と表面から200 Aの深さの間の内部にNi イオン導入量の99%以上が ほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のよ うにして調製したNi イオンを導入した酸化チタンから なる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを導入Ni イオン量の関数として測定した。得られた吸収スペクト ルを図4に示す。

## 【0033】実施例14

Niイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施例13と同様にしてNiイオンを注入した酸化チタンからなる光触媒を調製した。

加速エネルギー:150KeV

Niイオン照射量: $6.6 \times 10^{13}$  イオン/ cm² 得られたN i イオンが導入された酸化チタンからなる光触媒のN i イオンの分散状態を三次元S I M S およびX P S により測定した結果、N i イオン導入量は $6.6 \times 10^{13}$  イオン/ g - T i O であり、酸化チタンの表面と表面から200 A の深さの間の内部にN i イオン導入量の99 以上がほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のようにして調製したN i イオンを導入した酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを測定した。得られた吸収スペクトルを図4に示した。

## [0034] 実施例 15

50 Niイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施

例4と同様にしてNi イオンを注入した酸化チタンからなる光触媒を調製した。

加速エネルギー:150KeV

Ni イオン照射量: 1. 3×10<sup>16</sup>イオン/cm<sup>1</sup> 得られたNiイオンが導入された酸化チタンからなる光 触媒のNi イオンの分散状態を三次元SIMSおよびX PSにより測定した結果、Niイオン導入量は1.3× 10<sup>17</sup> イオン/g-TiO<sub>2</sub> であり、酸化チタンの表面 と表面から200点の深さの間の内部にNi イオン導入 量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認 10 された。上記のようにして調製したNiイオンを導入し た酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペ クトルを測定した。得られた吸収スペクトルを図4に示 した。図4より、比較例1と同様に酸化チタン単独では バンドギャップ値が約380nmで約400nm以下の 紫外光領域の光の吸収のみが起こり、可視光領域の光吸 収は全く起こらなかったが、Niイオンをイオン注入法 により注入した酸化チタン光触媒上では、400nm以 上の可視光の吸収が起こっている様子が分かる。以上の ように、本発明の特定の金属イオンを含有した酸化チタ 20 ンは、可視光領域の光を吸収するという、従来では考え られなかった光学特性を発現することが明らかとなっ た。

#### 【0035】実施例16

半導体の不純物のドーピングに用いる200KeVイオ ン注入装置を用い、Mnイオンを加速して150KeV のエネルギーにして、平均粒子径21nmである酸化チ タン(デグサ社製、商品名:P-25)に、Mnイオン 照射量を1×1011イオン/cm1にして照射し、酸化 チタンにMnイオンを注入した。得られたMnイオンが 30 導入された酸化チタンからなる光触媒のMnイオンの分 散状態を三次元SIMSおよびXPSにより測定した結 果、Mnイオン導入量は1×10<sup>15</sup>イオン/g-TiO ,であり、酸化チタンの表面と表面から200Aの深さ の間の内部にMnイオン導入量の99%以上がほぼ均一 に分散されていることが確認された。上記のようにして 調製したMnイオンを導入した酸化チタンからなる光触 媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを導入Mnイオン量 の関数として測定した。得られた吸収スペクトルを図5 に示す。

# 【0036】実施例17

Mnイオンの注入条件を下記のようにする以外は、実施例16と同様にしてMnイオンを注入した酸化チタンからなる光触媒を調製した。

加速エネルギー: 150KeV

Mn イオン照射量: 3×10<sup>1</sup> イオン/c m<sup>2</sup>

得られたMn イオンが導入された酸化チタンからなる光 触媒のMn イオンの分散状態を三次元SIMSおよびX PSにより測定した結果、Mn イオン導入量は $3 \times 10$ 10 イオン/10 の表面と表 面から200点の深さの間の内部にMnイオン導入量の99%以上がほぼ均一に分散されていることが確認された。上記のようにして調製したMnイオンを導入した酸化チタンからなる光触媒の紫外光~可視光吸収スペクトルを測定した。得られた吸収スペクトルを図5に示した。図5より、比較例1と同様に酸化チタン単独ではバンドギャップ値が約380nmで約400nm以下の紫外光領域の光の吸収のみが起こり、可視光領域の光吸収は全く起こらなかったが、Mnイオンをイオン注入法により注入した酸化チタン光触媒上では、400nm以上の可視光の吸収が起こっている様子が分かる。以上のように、本発明の特定の金属イオンを含有した酸化チタンは、可視光領域の光を吸収するという、従来では考えられなかった光学特性を発現することが明らかとなった。【0037】実施例18

#### ブテンの異性化反応

50m1のパイレックスガラス製定容容器に実施例4にて調製したCrイオン導入酸化チタン光触媒250mgを入れて密封した。真空排気後、20Torrのシス-2-ブテンを導入し、波長<math>450my下の光を光学フィルターにて遮断した水銀ランプを光源として、照度 $2,000\mu$   $W/cm^2$  の光をシス-2- ブテンの存在下で光触媒に照射し、室温でブテンの異性化反応を行った。反応生成物をマイクロシリンジで一定時間ごとに採取し、ガスクロマトグラフィーにて1- ブテン、トランス-2- ブテン生成の経過時間に対する生成量を定量した。この結果を図6 に示した。

#### 【0038】比較例2

実施例18においてCrイオン導入酸化チタン光触媒の代わりに、比較例1で使用した酸化チタン単独を用いる以外は実施例18と同様にしてシス-2-ブテンの異性化反応を行った。この結果を図6に合わせて示した。図6から明らかなように、約450nm以上の可視光照射下では、酸化チタン単独では殆ど反応が進行しないのに対して、本発明のCrイオン導入酸化チタン光触媒を使用することにより、シス-2-ブテンの1-ブテン、トランス-2-ブテンへの異性化反応が常温においても光触媒反応として効率よく進行することが分かる。

[0039] 実施例19

# 40 一酸化窒素の分解反応

50mlのパイレックスガラス製定容容器に実施例4にて調製したCrイオン導入酸化チタン光触媒250mgを入れて密封した。真空排気後、20Torrの一酸化窒素を導入し、波長450mm以下の光を光学フィルターにて遮断した水銀ランプを光源として、室温で一酸化窒素の分解反応を行った。このときの光の照度は2,000μW/cm²であった。反応生成物をサンプリングチューブで一定時間ごとに採取し、ガスクロマトグラフィーにてN<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>Oの生成量を経過時間に対して50 定量した。一酸化窒素は、生成物の量に応じて減少して

(8)

いることを確認した。この結果を図7に示した。 【0040】比較例3

実施例19においてCrイオン導入酸化チタン光触媒の代わりに、比較例1で使用した酸化チタン単独を用いる以外は実施例19と同様にして一酸化窒素の分解反応を行った。この結果を図7に合わせて示した。図7から明らかなように、約450nm以上の可視光照射下では、酸化チタン単独では反応が進行しないのに対して、本発明のCrイオン導入酸化チタン光触媒を使用することにより、一酸化窒素の分解反応が常温においても光触媒反 10 応として効率よく進行することが分かる。

# [0041] 実施例20

## ブテンの異性化反応

 $50\,\mathrm{m}\,1$ のパイレックスガラス製定容容器に実施例1にて調製したVイオン導入酸化チタン光触媒 $250\,\mathrm{m}\,g$ を入れて密封した。真空排気後、 $20\,\mathrm{T}\,o\,r\,r\,$ のシス-2 -ブテンを導入し、波長 $450\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ 以下の光を光学フィルターにて遮断した水銀ランプを光源として、照度2 ,  $000\,\mu\,\mathrm{W}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の光をシス-2 -ブテンの存在下で光触媒に照射し、室温でブテンの異性化反応を行った。反応生成物をマイクロシリンジで一定時間ごとに採取し、ガスクロマトグラフィーにて1 - ブテン、トランス-2 - ブテン生成の経過時間に対する生成量を定量した。この結果を図8に示した。

#### [0042]比較例4

実施例20においてVイオン導入酸化チタン光触媒の代わりに、比較例1で使用した酸化チタン単独を用いる以外は実施例20と同様にしてシス-2-ブテンの異性化反応を行った。との結果を図8に合わせて示した。図8から明らかなように、約450nm以上の可視光照射下では、酸化チタン単独では反応が進行しないのに対して、本発明のVイオン導入酸化チタン光触媒を使用することにより、シス-2-ブテンの1-ブテン、トランス-2-ブテンへの異性化反応が常温においても光触媒反応として効率よく進行することが分かる。

#### [0043] 実施例21

#### 一酸化窒素の分解反応

50mlのパイレックスガラス製定容容器に実施例lに て調製したVイオン導入酸化チタン光触媒250mgを 入れて密封した。真空排気後、20Torrの一酸化窒 40

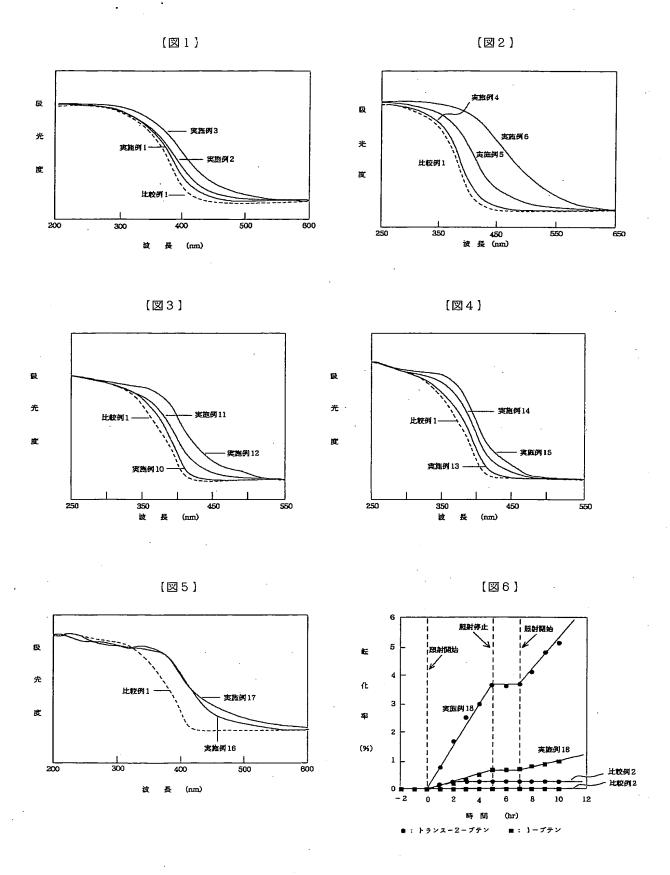
素を導入し、波長450nm以下の光を光学フィルターにて遮断した水銀ランプを光源として、室温で一酸化窒素の分解反応を行った。このときの光の照度は2,000 $\mu$ W/cm²であった。反応生成物をサンプリングチューブで一定時間ごとに採取し、ガスクロマトグラフィーにて $N_1$ 、 $N_2$ Oの生成量を経過時間に対して定量した。一酸化窒素は、生成物の量に応じて減少していることを確認した。この結果を図9に示した。

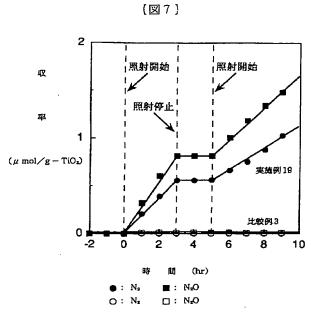
### [0044]

【発明の効果】本発明の光触媒は、紫外光領域はもちろんのこと、これまで不可能とされてきた可視光領域の光の吸収が起こるため、本発明の光触媒の存在下で、紫外光から可視光の光を照射して種々の光反応を促進させることができる。本発明の光触媒、光触媒の製造方法、および光触媒反応方法は、極めて画期的なものである。

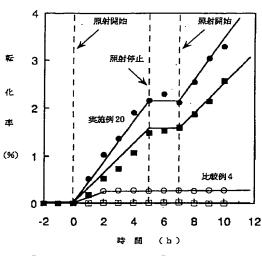
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施例である光触媒の紫外光~可視 光吸収スペクトルである。
- 【図2】本発明の一実施例である光触媒の紫外光~可視 20 光吸収スペクトルである。
  - 【図3】本発明の一実施例である光触媒の紫外光~可視 光吸収スペクトルである。
  - 【図4】本発明の一実施例である光触媒の紫外光~可視 光吸収スペクトルである。
  - 【図5】本発明の一実施例である光触媒の紫外光~可視 光吸収スペクトルである。
  - 【図6】本発明の一実施例である光触媒を使用したブテンの異性化反応方法において、1-ブテン、トランス-2-ブテン生成の経過時間に対する生成量を定量した図である。
  - 【図7】本発明の一実施例である光触媒を使用した一酸化窒素の分解反応方法において、N<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O生成の経過時間に対する生成量を定量した図である。
  - 【図8】本発明の一実施例である光触媒を使用したブテンの異性化反応方法において、1-ブテン、トランス-2-ブテン生成の経過時間に対する生成量を定量した図である。
  - 【図9】本発明の一実施例である光触媒を使用した一酸 化窒素の分解反応方法において、N,、N,O生成の経過 時間に対する生成量を定量した図である。



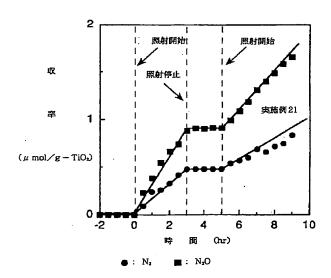






- : トランスー2ープテン
- : トランスー2ープテン
- : 1ープテン
- □: 1-ブテン





# フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記 <del>号</del>	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
B 0 1 J	23/22			B 0 1 J	23/26	Z	
						Α.	
	23/26				23/34	Z	
	•					Α	•
	23/34				23/38	Z	
					23/70	Z	
	23/38					ZABA	• ,

	23/70	ZAB	6958– 4H 6958– 4H	C 0 7 C	5/23 5/25	
	23/745		6958-4H		11/08	
	23/755			C 0 7 B	61/00	300
C07C	5/23			B01D	.53/36	J
	5/25		•			102G
	11/08			B01J	23/74	3 0 1 Z
// C07B	61/00	300				301A
						3 2 1 Z
						3 2 1 A

(72)発明者 佐藤 一仁

埼玉県幸手市権現堂1134-2

(72)発明者 藤本 尚則

茨城県北相馬郡守谷町松前台1-30-5-

202